

マークス型高周波グロー放電発光表面分析装置・JY 5000RF

製造元	株式会社堀場製作所
仕様	発光部…マークス型ランプ、高周波電源（周波数：13.56 MHz、出力：1 ～ 99 W） 分光部…ポリクロメーター（分光範囲：110 ～ 620 nm） 検出部…光電子増倍管（43 元素の同時測定が可能）
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・7階 727 室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	軽元素の測定には液体窒素費の実費が別途必要となる。
連絡先	材料工学専攻 技術職員 宇野優衣 075-753-5434 uno.yui.4u@kyoto-u.ac.jp
キーワード	GD-OES 、深さ方向、定性分析、表面分析、スパッタリング、多層膜、めっき、板状試料
機器コード	0000103001
自由記入欄	アルゴンプラズマによりスパッタされた原子を発光させることで表面、深さ方向の元素分析を行う装置である。ナノからミクロンオーダーまでの多元素一斉深さ方向定性分析（最大 100 μm 程度）が可能である。測定対象は直径 14 mm 以上の平滑な板状試料である。液体窒素を用いて分光部を窒素パージすることで H、C、O といった軽元素の検出も可能となる。 測定可能元素：Li、B、Na、Mg、Al、Si、K、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、As、Se、Sr、Y、Zr、Mo、Ag、Cd、In、Sb、Ba、Hf、W、Pt、Au、Pb、Bi 測定に液体窒素が必要な元素：H、C、N、O、P、S、Cl、Sn

令和3年3月25日現在

